**Криницкий, Александр Васильевич. Методы и средства оценки и прогнозирования сбоеустойчивости аналоговых интегральных микросхем при воздействии отдельных ядерных частиц : диссертация ... кандидата технических наук : 05.13.05 / Криницкий Александр Васильевич; [Место защиты: Нац. исслед. ядерный ун-т].- Москва, 2012.- 126 с.: ил. РГБ ОД, 61 13-5/468**